

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 03 404.8

Anmeldetag: 27. Januar 2003

Anmelder/Inhaber: Carl Zeiss Jena GmbH, 07745 Jena/DE

Bezeichnung: Verfahren zur Detektion von Fluoreszenzlicht

IPC: G 01 N 21/64

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 7. Januar 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

Hoiß

Verfahren zur Detektion von Fluoreszenzlicht

Die Detektion einzelner Fluorochrome in mehrfach markierten stark Licht streuenden Proben kann bisher durch die Auswahl der Anregungswellenlängen im sichtbaren Bereich und der Verwendung von entsprechenden Emissionsfiltern durchgeführt werden.

Bei überlappenden Emissionsspektren kann die Erfassung von Emissionsspektren mit anschließender Regressionsanalyse durchgeführt werden (Schäfer Patent). Die dabei verwendeten Detektoren sind in der Regel PMTs, die sich im Lichtweg hinter der Scanoptik des Mikroskops befinden. Dabei ist die Eindringtiefe des visuellen Lasers in Abhängigkeit von der Probe z. T. stark limitiert.

Die Verwendung eines Multiphotonenlasers bei der Erzeugung von Fluoreszenz in gefärbten, stark lichtstreuenden Proben lässt auch die Detektion der Emissionssignale mit Filtern zu.

Dabei können Fluoreszenzsignale voneinander getrennt werden, deren Emissionsspektren nicht oder nur geringfügig überlappen. Eine sequentielle Anregung der einzelnen Fluorochrome mit der benötigten Wellenlänge verbunden mit der Detektion des jeweiligen Signals (Multitracking) ist bei der Multiphotonenmikroskopie meist nicht möglich, da mit diesem Verfahren oft mehrere Fluorochrome gleichzeitig mit einer Wellenlänge angeregt werden, da sie breitere Anregungsspektren als bei Einphotonenanregung aufweisen.

Bei stark überlappenden Emissionsspektren der einzelnen Fluorochrome können auch in der Multiphotonenmikroskopie die Emissionssignale spektroskopisch über einen PMT Array mit vorgeschaltetem dispersivem Element (US 6,403,332) erfasst und anschließend über Regressionsanalyse getrennt werden.

Bei all diesen Verfahren stellt sich das Problem, dass Fluoreszenzsignale in tiefen Bereichen von stark streuenden Proben zwar erzeugt aber nur noch ungenügend detektiert werden können.

Das Problem wird durch die Merkmale der Patentansprüche gelöst.

Die Erfindung verbindet die Erstellung eines Anregungsspektrums mit Hilfe eines durchstimmbaren Ultrakurzpulslasers mit der Verwendung von non-descanned Detektoren (optimale Streulichtdetektion, Signal wird nicht über die Scanoptik geleitet) zur Aufzeichnung der Intensitäten des Fluorochroms / der Fluorochrome bei unterschiedlichen Wellenlängen.

Eine Verwendung dieser Bilder erfolgt, um Anregungsspektren zu erstellen und über Regressionsanalyse die Anteile der Intensitäten einzelner Fluorochrome in einer mehrfach markierten stark streuenden Probe zu bestimmen. Die Kombination der Verwendung eines Ultrakurzpulslasers und der non-descanned Detektoren ermöglicht die Erfassung von Anre-

gungsspektren auch in stark streuenden Proben und die Auftrennung der Signale von stark überlappenden Emissionsspektren.

Bei dem Verfahren wird folgendermaßen vorgegangen:

Erfassen der Anregungsspektren.

Eine fluoreszierende Probe wird mit dem Multiphotonenlaser beleuchtet. Der Lichtstrahl wird mit Hilfe eines Scanners über die Probe geführt. Das erzeugte Fluoreszenzsignal wird über optische Elemente auf den non-descanned Detektor geleitet. Die gesamte Intensität des Fluoreszenzsignals wird erfasst. Die Wellenlänge des UltrakurzpulsLasers wird in definierten Schritten variiert. Bei jeder Wellenlänge wird wieder die gesamte Intensität über den Detektor erfasst. Die bei jeder einzelnen Wellenlänge erzeugten Abbildungen des Fluoreszenzsignals werden in der Reihenfolge der Erfassung abgespeichert.

Das Anregungsspektrum wird für jedes Fluorochrom bestimmt.

Die Fluoreszenzintensität einer mehrfach gefärbten Probe wird unter den gleichen Bedingungen (Einstellung Laserintensität, Abtastschritte, Detektoreinstellung) bestimmt. Die Anregungsspektren der einzelnen Fluorochrome werden zur Bestimmung des Anteils von Fluorochromen in der mehrfach markierten Probe mit Hilfe einer Regressionsanalyse (Schäfer Patent) herangezogen.

Ausführungsbeispiel

In der Abbildung Fig. 1 ist schematisch ein durchstimmbarer KurzpulsLaser KP dargestellt, der über einen dichroitischen Strahlteiler ST1 und eine X/Y Scanreinrichtung SC ein Präparat P bestrahlt.

Neben einem wellenlängenselektiven Detektor MT hinter einer konfokalen Blende PH sind non-descanned Detektoren NDT1 und NDT2 vorgesehen, NDT1 für von der Probe P kommendes angeregtes Licht einschließlich Streulicht über einen Strahlteiler ST2 und NDT2 für Licht einschließlich Streulicht, das in der Probe erzeugt wird und durch die Probe hindurchgeht. Hier ist ein Anregungsfilter AF zur Blockierung des Anregungslichtes vorgesehen. Die Durchstimmung des KurzpulsLasers erfolgt beispielsweise in einem Wellenlängenbereich von etwa 700-900 nm, wobei z. B. Fluorophore mit einem Anregungsmaximum bei ca. 750 nm und 800 nm zunächst wellenlängenabhängig bezüglich der mit NDT1 oder NDT2 gemessenen Intensität erfaßt werden.

Sind diese beiden Fluorophore dann beide in einem Präparat vorhanden, wird bei Durchstimmen des Lasers ein Mischspektrum aufgezeichnet, das anschließend durch Regressionsanalyse separiert werden kann.

Patentansprüche:

1.

Verfahren zur Detektion und Auswertung des in einer fluoreszierenden Probe durch einen Kurzpulslaser erzeugten Lichtes,
wobei mindestens ein erstes und ein zweites Fluorophor und / oder eine selbst fluoreszierende Probeseperat mit unterschiedlicher Wellenlänge bestrahlt und das Probenlicht wellenlängenabhängig mit mindestens einem non- descanned Detektor als Referenzspektrum aufgezeichnet wird und bei Bestrahlung von mindestens zwei Fluorophoren und / oder selbst fluoreszierenden Proben gleichzeitig aus dem gemessenen Spektrum und den Referenzspektren durch Regressionsanalyse eine Trennung in Einzelspektren vorgenommen wird.

2.

Verfahren nach Anspruch 1, wobei in mindestes einem WL - Bereich die Wellenlänge des Kurzpulslaser kontinuierlich geändert wird.

3.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei eine scannende Abtastung zumindest eines Teils der Probe erfolgt und für die jeweils eingestellte Wellenlänge ein Fluoreszenzbild der Probe / des Teils der Probe detektiert und abgespeichert wird.

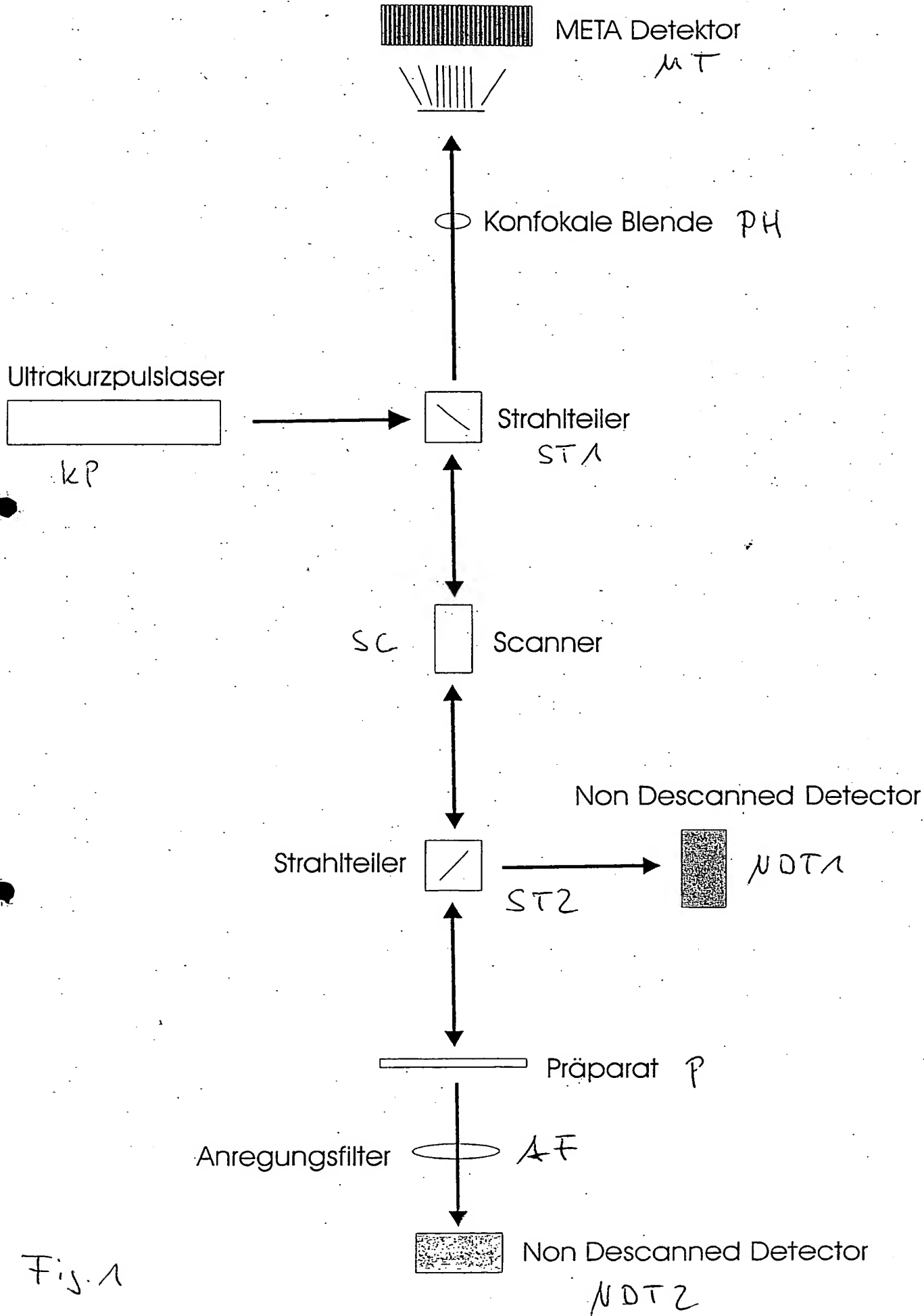


Fig. 1